CM10 涂层测厚仪

使用说明书

沈阳宇时先锋检测仪器有限公司

景

1 概述
1.2 仪器各部分名称
1.3 技术参数
2 仪器的使用
2.1 仪器使用前准备
2.2 检查电源
2.3 仪器初始化
2.4 探头类型设置(CM10)
2.5 基本设置
2.6 统计数据查询与统计数据删除1
2.7 删除当前测量数据1
2.8 背光灯控制1
2.9 探头切换(CM10FN)1
2.10 通讯连接1
2.11 关机1
3 仪器的校准1
3.1 零点校准1
3.2 一点校准1
3.3 两点校准1
3.4 校准数据删除方法1
4 影响测量精度的因素1
4.1 影响因素相关表1
5 保养与维修1
5.1 环境要求1
5.2 更换电池1
5.3 仪器维修1

1 概述

CM10 系列涂层测厚仪是一种便携式的测量仪器,它设计用于无损伤的且快速、精密地进行涂、镀层厚度测量。既可以用于实验,也可以用于工程现场。

本仪器符合以下标准:

GB/T 4956—2003 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法

GB/T 4957—2003 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法

JB/T 8393-1996 磁性和涡流式覆层厚度测量仪 JJG 818-2005 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪

特点:

- CM10F和 CM10FH 采用磁性测量方法,可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度。
- CM10N 采用涡流测量方法,可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度。
- CM10FN 既可采用磁性测量方法,又可采用涡流测量方法。
- CM10 为可更换探头类型,可配备 3 种不同型号的探头。
- CM10F 测量最大厚度到 3mm, CM10FH 测量最大厚度到 10mm, CM10N 测量最大厚度到 2mm, CM10FN 测量最大厚度到 1.5mm。
- CM10系列涂层测厚仪具有高、低两种分辨力显示。
- ◆ 设有五个统计量:测量次数(N)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、 平均值(MEAN)和标准偏差(STD.DEV)。
- 可采用零点校准、一点校准和两点校准三种方法对仪器进行校准。
- 具有电源欠压指示功能。
- 操作过程有蜂鸣声提示。

● 1.1 配置清单

1.1.1 标准配置

标准配置				
型号	CM10F	CM10N	CM10FN	CM10FH
主机	1台			
探头	与仪器一体			
校零板(块)	Fe×1	Al×1	$Fe \times 1 + A1 \times 1$	Fe×1
校准用厚度片	1套			
电池	2 节 1 条			
USB 通讯线				
通讯光盘	1 张			
使用说明书	1本			
仪器密封箱	1个			

1.1.2 选配件

- ●校准用厚度片
- ●铁基校零板
- ●铝基校零板

1.2 仪器各部分名称

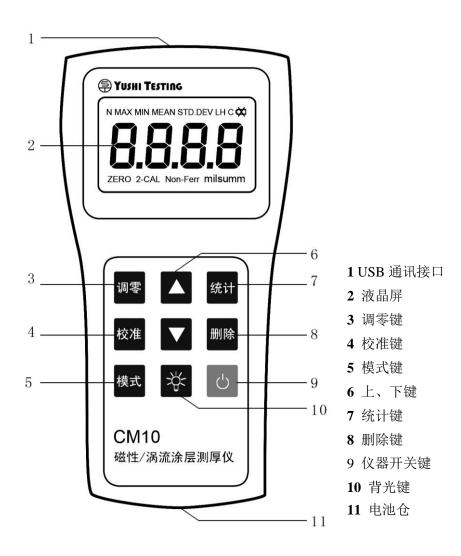


图 1.1 仪器主机(CM10F/CM10N/CM10FH 通用)

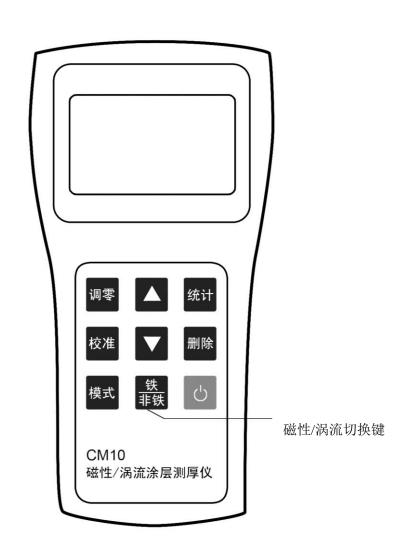


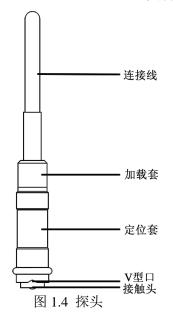
图 1.2 仪器主机(CM10FN)



图 1.3 液晶屏

- 1 统计标志
- 2 分辨力标志
- 3 低电压标志
- 4 数据线连接标志
- 5 数值显示区

- 6 调零标志
- 7 校准标志
- 8 探头类型标志
- 9 公制单位标志
- 10 英制单位标志



1.3 技术参数

1.3.1 仪器测量范围及测量误差

仪岩	器型号	CM10F	CM10N	CM10FH	CM10FN
工化	作原理	磁感应	电涡流	磁感应	磁感应/ 电涡流
测量剂	范围(μm)	0~3000	0~2000	0~10000	0~1500
低限分	辨力(μm)	0.1	0.1	0.1	0.1
示值i	吴差(μm)	±(2%H+2)	±(2%H+2)	±(2%H+10)	±(2%H+2)
测试	最小曲率 半径(凸)	5	5	10	5
条件 (mm)	最小面积 直径	Ф20	Ф20	Ф40	Ф20
(mm)	基体临界 厚度	0.5	0.5	2	0.5

表 1.1 仪器参数表

1.3.2 使用环境

温度: -10℃~+50℃ 无强磁场环境

1.3.3 电源

二节 AA 型 1.5V (5 号) 电池

1.3.4 外型尺寸和重量

外型尺寸: 149mm×73mm×32mm

重量 (不含电池): 250g

2 仪器的使用

2.1 仪器使用前准备

- 1. 准备好将要被测量的工件。
- 2. 探头远离被测工件。
- 3. 按"**心**"键,仪器鸣响一声后开机,CM10系列开机界面如图 2.1, 若仪器当前使用的是磁性测量方式,仪器开机画面见左下图,若仪器 当前使用的是涡流测量方式,仪器开机画面见右下图。

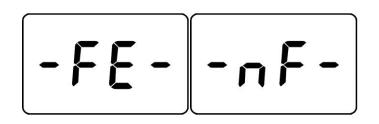


图 2.1 仪器开机

短暂停留后屏幕界面切换至初始化状态,如图 2.2

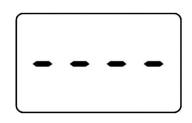


图 2.2

4. 仪器再次鸣响一声完成开机自检后即可开始测量使用。

2.2 检查电源

如果" 🛱 "符号点亮,表示电池电量不足,应及时更换电池。

提示: 1. 电池电量低不会导致测量数值错误

- 2. 更换电池不会导致仪器内保存的数据丢失
- 3. 仪器长时间不使用应将仪器中的电池取出

2.3 仪器初始化

仪器处于关机状态,按住"删除"键不放,再按下"心"键,听到蜂鸣声后,表示仪器初始化完毕。仪器初始化目的在于删除仪器内存储的所有统计数据和校准数据,并恢复基本模式设置。

2.4 基本设置

按"模式"键,则进入测量单位设置;再次按下"模式"键,则进入高、低分辨率设置。三次按下模式键退出基本设置。

注意: CM10FN 三次按下模式键进入背光设置, 背光设置仅有熄灭与常亮两种方式。再次按下模式键退出基本设置。

2.4.1 测量单位设置

进入测量单位设置后,按"↑"或"↓"键调整。0 为公制测量模式,默认以μm 为单位显示厚度值,且μm 图标点亮(如图 2.3), CM10 系列涂层测厚仪会根据测量厚度自动转换测量单位μm(微米)与 mm(毫米);1 为英制测量模式,默认以 mils(密耳,千分之一英寸)为单位, mils 图标点亮。

Ferr um

图 2.3

2.4.2 测量分辨力设置

进入测量分辨力设置后,按"↑"或"↓"键调整。0为高测量分辨力模式,屏幕显示图标"H"(如图 2.4)。1为低测量分辨力模式,屏幕显示图标"L"。

注意: CM10FN 中, 0 为低测量分辨力模式, 1 为高测量分辨力模式。 后续程序升级可能会统一操作, 具体以实际情况为准。

高、低分辨力对比见表 2.2。



图 2.4

	范围分辨力	0~999um			≥1mm	
	高分辨力	0~99.9un	0~99.9um 100~999um			
		0.1um		1um		0.01
	低分辨力	0~200um	200~500um		500~999um	0.01mm
		1um	2um		5um	

表 2.2

2.5 统计数据查询与统计数据删除

CM10 系列仪器的统计数据包括测量次数(N)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、平均值(MEAN)和标准偏差(STD.DEV)。

循环按下"统计"键即可查询统计数据,所有统计数据查询完毕后退 出统计数据查询系统。在查询统计数据过程中,按下"删除"键即可删除 所有统计数据,并退出查询。

2.6 删除当前测量数据

仪器使用过程中,若当前探头测量数据不想被统计保存,按下"删除" 键即可删除当前测量数据,不会影响之前的测量结果。

2.8 背光灯控制

仪器提供背光功能,以便在光线暗处阅读测量值,CM10 系列仪器 (CM10FN 除外)具有省电背光模式,按"文"键,可循环控制屏幕背光灯的短亮、长亮或者熄灭。

CM10 系列仪器调整至省电背光模式,即短亮,仅在仪器测量使用过程中背光灯会点亮,目在5 秒后自动熄灭。

2.9 探头切换 (CM10FN)

按"铁/非铁"键可进行探头类型选择。

2.10 通讯连接

数据线一端连接电脑 USB 口,另一端连接仪器,仪器鸣响一声提示连接成功,同时仪器屏幕会显示"C"(Connect)标志。

2.11 关机

本仪器设有自动关机和手动关机两种方式,在无任何操作的情况下, 大约 3 分钟后仪器自动关机,或长按"**心**"键,仪器关机。

3 仪器的校准

3.1 零点校准

3.1.1 校准条件

被测物件上有调零点,即无涂、镀层的位置。

3.1.2 校准步骤

- 1. 按"调零"键,屏幕显示"MEAN"图标目"ZERO"图标闪烁:
- 2. 探头每次平稳地落到被测物件的调零点上,仪器屏幕出现数值,为1次调零动作。若调零次数不满10次,按下"调零"键,退出调零模式。若校准次数满10次,仪器自动退出调零模式。
- 3. 退出调零过程后, "MEAN"图标熄灭, 若仪器内部有调零数据,则 "ZERO"图标点亮, 否则"ZERO"图标不亮。

3.2 一点校准

3.2.1 校准条件

校准箔片与待测工件的涂、镀层厚度接近。

3.2.2 校准步骤

1. 按"校准"键,屏幕显示"MEAN"图标且"CAL"图标闪烁。

- 2. 将校准箔片放置在被测工件的校零点上,探头每次落在校准箔片上为 1 次校准动作。校准次数最多为 10 次, 用"↑"或"↓"键调整屏幕 读数使其达到校准箔片上标注的数值,再按下"校准"键,退出校准模 式。
- 3. 退出校准模式后,"MEAN"图标熄灭,若仪器内部有校准数据,则 "CAL"图标点亮, 否则 "CAL"图标不亮。

3.3 两点校准

3.3.1 校准条件

两个校准箔片厚度至少相差三倍, 且待测涂、镀层厚度值在两个校准 箔片之间。

3.3.2 校准步骤

两点校准方法与一点校准方法基本相同,不同点在于校准第二个校准 箔片时, "CAL"图标改变为"2-CAL"图标。

3.4 校准数据删除方法

进入校准模式后,校准次数为0,按下"删除"键,仪器删除所有校 准数据,并退出校准过程;若校准次数不为0,按下"删除"键,则不保 存当前校准数据并退出校准模式,使用原有校准数据。

4影响测量精度的因素

4.1 影响因素相关表

测量方法影响因素	磁性方法	涡流方法
基体金属磁性质	√	_
基体金属电性质	_	√
基体金属厚度	√	√
边缘效应	√	√
曲率	√	√
试样的变形	√	√
表面粗糙度	√	√
磁场	√	_
附着物质	√	√
探头压力	√	√
探头取向	√	√

表 4.1 影响因素相关表 ✓ : 表示有影响

5 保养与维修

5.1 环境要求

严格避免碰撞、重尘、潮湿、强磁场和油污等。

5.2 更换电池

当仪器出现低电压指示时,应尽快跟换电池,方法如下:

- 1. 按"心"键关机:
- 2. 打开电池仓盖;
- 3. 取出电池,放入新电池,注意极性;
- 4. 盖好电池仓盖。

注意:如非特殊情况,不建议在仪器处于开机状态下直接取出电池。

5.3 仪器维修

如出现以下问题请与我厂维修部联系:

- 1. 仪器器件损坏,不能测量。
- 2. 显示屏显示不正常。
- 3. 正常使用时,误差过大。
- 4. 键盘操作失灵或混乱

由于本涂层测厚仪为高科技产品,所以维修工作应由受过专业培训的 维修人员完成,请用户不要自行拆卸修理。